# L0 フォノン-価電子帯間遷移の量子干渉におけるキャリア分布の影響

# The influence of hole distribution on interference

## between LO phonon and inter valence band transition

# <sup>0</sup>坂本裕則,馬蓓,森田健,石谷善博(千葉大院工)

#### °Hironori Sakamoto, , Ma Bei, Ken Morita, Yoshihiro Ishitani (Chiba Univ.)

E-mail: adna3566@chiba-u.jp

離散準位と連続準位の量子干渉効果はファノ干渉 として知られている[1]。フォノン系ではLOフォノ ンによる離散準位と価電子帯間遷移による連続準位 による干渉効果が調査されている[2,3]。本研究ではフ オノン系電磁誘起透明化[4]によりTHz領域光変調へ の応用につながる2種LOフォノンが関与する量子 干渉効果について p型Ga<sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>Pを用いて調査して いる。これまで、ラマンスペクトルのフィッティング 解析(図1)により量子干渉効果の特徴である非対称形 状、アンドープ試料に対するLOフォノンエネルギー シフトおよびエネルギー幅の増大を観測した。さら にエネルギー幅に対して材料の分極の依存性を評価 することで材料の物性値の反映を示した。今回、非対 称形状の度合いを示すパラメータ q とエネルギーシ フト量  $\Delta E$ の正負について評価を行った。

図1に本研究で得られた GaInPの $q \ge \Delta E$ の値を示 す。参考文献[3]では GaAs の量子干渉効果において q=-0.9,  $\Delta E=-10$  cm<sup>-1</sup>が得られており、本研究と正負が 異なる。価電子帯間遷移に起因する電子の分布を考慮 して  $\Delta E$ 、qを計算すると式(1)のようになる。

$$q, \Delta E \propto P \int \frac{f(E_{\rm lh})\{1 - f(E_{\rm hh})\}g_c(E')}{E_{\rm LO} - E'} dE'$$
 (1)

ここで、P は主値積分を表す。 $E_{LO}$ は LO フォノンエ ネルギー、f(E)はフェルミ分布関数、 $g_c(E)$ は結合状態密 度、 $E_{lb}, E_{hb}$ は  $E'=E_{lb}-E_{hb}$ を満たす軽い正孔、重い正孔バ



図 2 GalnP (p=1.5×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>, T=300 K)と GaAs (p=8×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>, T=10 K)の キャリアの熱分布関数

ンドのエネルギーである。これらの式の被積分関数は  $E'\sim E_{\rm LO}$  付近が支配的になり、 $E'< E_{\rm LO}$  で正、  $E'>E_{\rm LO}$  で負になる。したがって積分値は  $f(E_{\rm h})$ {1- $f(E_{\rm hh})$ } $g_c(E')$ の  $E'\sim E_{\rm LO}$  付近の傾きが右上がりであ れば負、右下がりであれば正となると考えられる。図 2 に GaAs, GaInP それぞれについて、試料 のホール濃度 p と測定温度 T から計算された  $f(E_{\rm h})$ {1- $f(E_{\rm hh})$ } $g_c(E')$ を示す。  $f(E_{\rm h})$ {1- $f(E_{\rm hh})$ } $g_c(E')$ の  $E'\sim E_{\rm LO}$  付近の傾きは GaInP では右下がり、GaAs では右上がりになっている。これは GaInP の LO<sub>2</sub> と GaAs の q,  $\Delta E$  の正負と一致する。一方、GaInP の LO<sub>1</sub> についてはシフト量がフィッティングに よる誤差に対して小さく、本結果ではシフト量の正負は分からない。また、参考文献[2]の Si では  $q>0, \Delta E<0$  という結果が得られている。この原因として Si の非対称な伝導帯構造の影響が考えら れるが、はっきりとは分かっていない。しかし GaInP, GaAs では価電子帯のキャリアの熱分布が 量子干渉効果に影響していることが検知された。

## [参考文献]

[1] U.Fano, Phys.Rev, **124**, 1866 (1961) [2] B. G. Burke, J. Chan, K. A. Williams, Z. Wu, A. A. Puretzky, and D. B. Geohegan, J. Raman Spectrosc, **41**,1759 (2010) [3] G. Irmer M. Wenzel and J. Monecke, Physics of Semiconductors. **1**, 217 (1996) [4] S. E. Harris, Phys. Rev. Lett. **62**,1033 (1989)